

信頼性資料

発行日2015年3月13日
資料No. IRC-JFET-2-A

作成:イサハヤ電子(株)品質保証統括

1. 信頼性試験結果

グループ	試験項目	試験条件	試料数	故障数	備考
1	はんだ付け性	はんだ温度 230℃ 浸漬時間 5秒 ロジン系フラックス使用	45	0	
2	はんだ耐熱性	はんだ温度 260℃ 浸漬時間 10秒 端子根元1.5mmまで浸漬	22	0	
3	ウイスカ	60℃、90%RH、4000hr	20	0	
		-40℃、85℃、各30分、1500サイクル			
		常温常湿、8760hr			
4	温度サイクル	Ta=Tstg(min)～Tstg(max) 各30分／サイクル 100サイクル	45	0	
5	耐湿性	Ta=85℃、85%R.H 1000時間	45	0	
6	高温保存	Ta=Tstg(max) 1000時間	45	0	
7	高温逆バイアス	Ta=Tstg(max) VGD=VGDO(max) 1000時間	45	0	
8	PCT	121℃ 100%R.H. 2気圧 96時間	45	0	
9	連続動作	Ta=25℃ PT=PT(max) 1000時間	45	0	
10	端子強度	2.45N, 90°、曲げ2回	22	0	

2. 故障判定基準

グループ	故障判定基準	
1	はんだ付着面積が浸漬部の95%未満のもの	
3	50μm未満を満足しないもの	
10	リード折れ等の異常が認められるもの	
2, 4～9	測定項目	判定基準
	V(BR)GDO	電気的特性を満足しないもの 初期値に対する変化率±20%を超えるもの
	IGSS	電気的特性を満足しないもの
	IDSS	
	外観目視	著しい変化が認められるもの

測定条件:製品仕様書の測定条件に準ずる

上記内容につき詳細ご確認が必要な際は
弊社営業部門までお問い合わせ願います。